

15. 09. 2014

לכבוד תמר בר-און
המשרד להגנה הסביבה

הנדון: קביעת ריכוז סיליקה חופשית בדוגמת צובר

מצורפות בזה תוצאות קביעת ריכוז סיליקה חופשי בדוגמת צובר של פסולת זכוכית.
האנליזה בוצעה בשיטת X-Ray Diffraction
מכשיר X-Ray Diffractometer, תוצרת Philips, מודל PW-1050/70, מתח - 40kv,
זרם - Graphite - Monochromator, 28ma.

מס. עבודה 14-359.

המרכיבים העיקריים של הדגימה הם Amorphous glass.
תכולתו של קוורץ כ 0.5%~.

סטית התקן של השיטה - (Relative) ±.20%.

בברכה

ד. מוגיליאנסקי